



第5回 次世代ユビキタス・ パワーエレクトロニクスのための 信頼性科学ワークショップ

The 5th Workshop on Reliability Science for Future Ubiquitous Power Electronics

～サイバーフィジカルシステム時代に向けた新しい信頼性科学の息吹～
The Breath of New Reliability Science for Cyber-Physical System

会期
Date

2014.1月28日(火)
January 28, 2014

会場
Venue

発明会館ホール
Hatsumeikaikan Hall

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-9-14
TEL:03-3502-5499
Toranomon2-9-14, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Japan

アクセス
Access

【東京メトロ】
銀座線 虎ノ門駅 3番出口 / 徒歩5分
日比谷線 神谷町駅 4番出口 / 徒歩6分
千代田線 霞が関駅 A13番出口 / 徒歩13分
<http://hatsumeikaikan.com/access1.html>

参加費:無料 [事前登録制] Admission Free

発明会館
周辺地図



○主催:北九州市 / 公益財団法人国際東アジア研究センター

Sponsored by City of Kitakyushu / The International Centre for the Study of East Asian Development(ICSEAD)

○共催:独立行政法人産業技術総合研究所 / 国立大学法人九州工業大学

Co-sponsored by National Institute of Advanced Industrial Science and Technology(AIST) / Kyushu Institute of Technology

○後援:公益財団法人北九州産業学術推進機構 / 一般社団法人電気学会 / NPERC-J

Supported by Kitakyushu Foundation for the Advancement of Industry, Science and Technology(FAIS) / The Institute of Electrical Engineers of Japan (IEEJ) / NPERC-J

第5回 次世代ユビキタス・パワーエレクトロニクスのための信頼性科学ワークショップ

The 5th Workshop on Reliability Science for Future Ubiquitous Power Electronics

～サイバーフィジカルシステム時代に向けた新しい信頼性科学の息吹～The Breath of New Reliability Science for Cyber-Physical System

開会挨拶 13:00～ “Opening Remarks”

大橋 弘通 北九州市
Hiromichi Ohashi, City of Kitakyushu

講演・第1部 13:10～ “Keynote Speeches”

“Center of Reliable Power Electronics - mission profile and reliability in renewable energy systems”

*講演は英語で行います。通訳はありません。

Frede Blaabjerg, Aalborg University

『障害回復力のあるエネルギーネットワークに向けて』

“Toward Fault-Resilient Energy Network in Cyber-Physical System Era”

門 勇一 京都工芸繊維大学
Yuichi Kado, Kyoto Institute of Technology

休憩 14:50～

Break

講演・第2部 15:10～ “Technical Sessions”

『ICTネットワークのグリーン電源システム』

“Green Power Supply Systems for ICT Networks”

二宮 保 国際東アジア研究センター(ICSEAD)
Tamotsu Ninomiya, The International Centre for the Study of East Asian Development(ICSEAD)

『双方向分散電源とICTネットワーク』

“Bidirectional Distributing Power Supply for ICT Network System”

安部 征哉 国際東アジア研究センター(ICSEAD)
Seiya Abe, The International Centre for the Study of East Asian Development(ICSEAD)

『シリコン超高速パワーダイオードの可能性』

“Silicon High Speed Power Diode”

附田 正則 国際東アジア研究センター(ICSEAD)
Masanori Tsukuda, The International Centre for the Study of East Asian Development(ICSEAD)

『ICTを支えるパワーMOSFETの高信頼化技術』

“Highly Reliable Power MOSFETs for ICT Applications”

松本 聡 九州工業大学
Satoshi Matsumoto, Kyushu Institute of Technology

『パワーエレクトロニクスのユビキタス化を支える故障メカニズム特定技術』

“Real-Time Failure Analysis for Future Ubiquitous Power Electronics”

渡邊 晃彦 九州工業大学
Akihiko Watanabe, Kyushu Institute of Technology

『高集積化PEシステムへ向けた統合設計技術』

“Loss Modeling for Highly Integrated PE Systems”

中島 昭 産業技術総合研究所(AIST)
Akira Nakajima, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

閉会挨拶 17:10～ “Closing Remarks”

大村 一郎 九州工業大学
Ichiro Omura, Kyushu Institute of Technology

| 申 | 込 | 方 | 法 | Registration

Webから

下記のWebアドレスにアクセス後、必要事項をご記入のうえお申込み下さい。

<http://axconv.jp/reliability/>

FAXから

下記に必要事項をご記入のうえお申込み下さい。

FAX: 093-692-3003

【お問い合わせ先】運営委託:(株)アクシス/担当:佐藤・金剛(こんごう) ◇受付時間/平日:月～金曜日 9:00～17:00

TEL:093-603-8786 E-mail:reliability@axconv.jp

会社または団体名・所属

役職・氏名(ふりがな)

連絡先住所

電話番号・Eメール

お預かりした個人情報については、本事業の運営のみに使用し、事務局にて責任をもって管理いたします。また、ホールの収容人数に達した場合には締め切り前に申し込み受付を終了する場合があります。